DIN 51390-4:2000-11 (D)

Prüfung von Mineralölerzeugnissen - Bestimmung des Siliciumgehaltes - Teil 4: Direkte Bestimmung durch optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv angekoppeltem Plasma (ICP OES)

Inhalt

Seite

Vorwort 1

1 Anwendungsbereich 1

2 Normative Verweisungen 1

3 Einheit 1

4 Prinzip 2

5 Bezeichnung 2

6 Geräte 2

7 Chemikalien 2

8 Aufstellen der Silicium-Bezugskurve 2

9 Probenvorbereitung 2

10 Durchführung 2

11 Auswertung 2

12 Angabe der Ergebnisse 3

13 Präzision des Verfahrens 3
13.1 Wiederholbarkeit (*r*) 3
13.2 Vergleichbarkeit (*R*) 3